



俄罗斯ATE制造与开发行业引领者，产品广泛用于电子元器件及设备质量管理

阿查克弗斯科高速公路34，莫斯科，119530

电话: +7 (495) 269-75-90
+7 (495) 269-75-91
传真: +7 (495) 269-75-94
Email: info@form.ru
Website: www.form.ru

FORMULA® HF ULTRA	FORMULA® HF3 / HF3-512	FORMULA® 2K
550 MHz / 1024 pins	200 MHz / 512 pins	20 MHz / 256 pins

微电路功能和参数测试的测试系统

数字VLSI电路: FPGA; ASICs; 微处理器与微控制器; 静态和动态内存; VLSI SoC、ADC和DAC; SiP。

数字VLSI电路: FPGA; ASICs; 微处理器与微控制器; 静态和动态内存; ADC 及 DAC、RFID。

数字LSI电路及集成微电路: 逻辑电路组; FPGA; ASICs; 微控制器; RAM; 模拟集成微电路: DAC及ADC; 运算放大器、比较器; 开关; 稳压器。



计量工具型式认可证书	2015年10月9日No. 59985					2012年9月11日No. 48039; 2013年10月16日 No. 52665		2013年4月12日No. 31123		
功能测试频率	高至550 MHz					高至200 MHz		高至20 MHz		
最小脉冲持续时间	800 ps					1.65 ns		Not specified		
800 ps	1.65 ns					4 ns		4 ns		
最小脉冲上升沿/下降沿持续时间	275 ps					0.7 ns		未标明的		
双向针数	高至1024					高至512		高至256		
向量/错误内存	128 M/128 M					64 M/64 M		1 M/1 M		
逻辑电压范围	-1.5...+6.5 V					-2...+7.5 V		-10...+10 V		
每路引脚可测参数范围(PPMU)	高至1024; -2...+13 V					512; -2...+8 V		否		
PMU数目	高至32					高至16		高至4		
PMU的电压范围	-2...13 V					-2...+8 V		-20...+20 V		
PMU电流范围	±15mA					±15mA		±200 mA		
测量资料的数量	高至32	高至32	高至8	2	1	高至16		高至4	高至4	高至4
测量源的电压范围	0...+6 V	-2...+15 V	-17...+17 V	0...+4.5 V	0...+3.5 V	0...+6 V	-2...+15 V	-20...0 V	0...+20 V	-8...8 V
测量源电流范围	-4...+4 A	-400...+400 mA	-500...+500 mA	-20...+20 A	-50...+50 A	-4...+4 A	-400...+400 mA	-2...+2 A		
DAC和ADC微电路的测量	ARP 模块1200 MHz/1200 MOPs/24 bits 针对静态参数测量高达16 bit DAC及ADC, 动态参数高达14 bit/260 MHz ADC					用于测量高达14bit的DAC和ADC静态参数的PRIMA适配器		用于测量高达12 bit DAC和ADC静态参数的IZMER 精密测试模块		
BIST 技术	用于在FPGA中填充配置文件的集成JTAG端口; 带STAPL语言支持的集成JAM PLAYER									

FORMULA® TT2		FORMULA® R		FORMULA® CK	
2000 V / 100 A / 50 μs		800 V / 0.5 A / 0...300 ms		192 pins / 20MHz / ±30 V	
半导体器件静态参数的测试和测量		根据GOST16121-86 和 GOST 5945-002-2008对低电流直流电磁继电器进行测试和测量		电子设备模块和组件的测试和诊断	
晶体管; 稳压器二极管; 晶体闸流管; 二极管; 光耦合器		电流的电磁继电器; 电阻组件		电子设备和线路替换部件的数字及模拟程序集	
					
2013年10月16日No. 52666计量工具型式认可证书		2015年4月27日No. 39604测量工具型式认证证书		2015年9月9日No. 40237计量工具型式认可证书	
电压源	5个源: 10 V、20 V、200 V、500 V、2000 V	绕组数	1...8 线圈/500 mA/120 V	边缘终端测试的双向通道数量	192
电流源	4个源: 5 mA; 200 mA; 10 A; 100 A	接触组数	1... 12 接触组数	功能测试频率	20 MHz
低电流模式	0.2 nA起	电压/绝缘电阻	高至800 V/10 Gohm	向量/错误内存	1 M/1 M
脉冲持续时间	300 μs ... 100 s	绕组电阻	3 Ohm... 100 kOhm	每路引脚的电压逻辑范围	-30...+30 V
时间分辨率	50 μs	瞬变电阻	1 mOhm...100 Ohm	PMU电压范围	-20...+20 V
工作站数量	1 或2	时间分辨率	0.8 μs	PMU数量	2
每个GOST的准备测量方法的数量	65	驱动/发布时间	0.03... 300 ms	测量源电压范围	-30...+30 V
温度试验开关	对多达20个半导体器件的组测温度测试	弹跳时间	0.01... 300 ms	数量的测量资料	6
		驱动/释放时间的多样性	0... 300 ms	测量源电流范围	-2...+2 A
		接触摇摆时间	0... 300 ms	外部设备控制开关	连接到任何192个频道的4个外部设备
		工作站数量	1 或2	电路参数和签名分析仪通道	1
				外部示波器同步通道	2